# CONCLUSIÓN

Como fue mencionado anteriormente, la constante evolución de los circuitos integrados y de los procesos litográficos, han permitido desarrollar dispositivos más potentes y eficientes, pero al mismo tiempo, los efectos producidos por los ASETs son más frecuentes, reduciendo así, la confiabilidad de los mismos.

Durante décadas se analizaron los SEEs sobre estructuras digitales dejando un vacio en el campo analógico. El presente trabajo pretende contribuir al estudio de los ASETs aportando información sobre los efectos en conversores flash.

La campaña de inyección manual permitió comprender el efecto de los ASETs en los comparadores, como también, brindar un grupo confiable de resultados utilizado como base para la campaña automática. Debido a la cantidad de simulaciones y resultados a analizar, se optó por la creación del entorno virtualizado y el desarrollo de la aplicación.